# 科学研究費補助金研究成果報告書

平成 22 年 6 月 28 日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2008~2009 課題番号:20760226 研究課題名(和文) 可塑基板へのカルコパイライト半導体薄膜の成長と太陽電池への応用 研究課題名(英文) Fabrication of high quality chalcopyrite thin-film on flexible substrate and application to solar cells 研究代表者 峯元 高志 (MINEMOTO TAKASHI) 立命館大学・立命館グローバル・イノベーション研究機構・准教授 研究者番号:80373091

#### 研究成果の概要(和文):

高効率太陽電池の光吸収層として期待される CuInSe,(CIS)系薄膜を、可塑基板上へ作製する 技術を開発した。結晶成長に適した組成比に制御した上で短時間熱処理を行うことで、CISの 結晶成長に十分な耐熱性を持っていないポリイミド基板上でも、結晶粒径の増大に成功した。 また新たなアプローチとして、引き剥がし法による高品質 CIS 系薄膜の可塑基板上への転写に も取り組み、動作する太陽電池の試作にも成功した。

#### 研究成果の概要(英文):

CulnSe<sub>2</sub> (CIS) thin-films, which is expected as high-efficiency solar cells, were fabricated on flexible substrates. The composition and rapid thermal anneal realized large crystal grains on polyimide substrate which does not have enough thermal tolerance. Also, another approach of lift-off process which transfers thin-films to alternative substrates was developed and working device was successfully fabricated.

### 交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計	
2008 年度	2,300,000	690,000	2,990,000	
2009 年度	1,100,000	330,000	1,430,000	
年度				
年度				
年度				
総計	3,400,000	1,020,000	4,420,000	

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学 電子デバイス・電子機器 キーワード: 高効率太陽光発電材料・素子、結晶成長

## 1.研究開始当初の背景

太陽電池は環境問題が懸念される今日、クリ ーンエネルギーとして期待されている。現在

晶系 Si 太陽電池である。最近では、新型太 陽電池としてカルコパイライト化合物半導 体薄膜である CuInSe<sub>2</sub>(CIS) が高効率・低コ の主流は 200µm 厚の結晶 Si の板を用いた結 | スト太陽電池として期待されている。CIS の 光吸収係数は Si に対して 100 倍大きいため、 膜厚 2μm で太陽光を全て吸収でき、省材料の 観点から有利である。

従来の CIS 太陽電池は基板に数 mm 厚のガラ スを用いているために可塑性がなく、屋根に 載せる大型太陽電池モジュールに利用され ている。基板材料に可塑性を有する軽量基板 を用いることができれば、軽量フレキシブル 太陽電池を作製でき、光があればどこでも発 電でき、軽量・フレキシブルゆえにどこにで も装着・携帯できるユビキタス電源としても 期待でき、応用範囲を広げる事ができる。

ー方で、軽量フレキシブル基板の候補として ポリイミド(PI)などのポリマー箔が考えら れるが、高品質 CIS 薄膜の成長に必要とされ る 500 以上には十分な耐熱性を有しておら ず、CIS 結晶成長法の工夫や新プロセスが必 要とされている。

#### 2.研究の目的

本研究では軽量フレキシブル基板としてポ リイミド(PI)を用いる。CISの成長には多 元蒸着法を用いて、結晶成長が促進される組 成に制御し、かつ短時間だけ高温にすること で結晶の大粒径化を図った。こうして、高品 質 CIS 薄膜のポリイミド上への作製技術確立 を目的とした。また、もう一つのアプローチ として、ガラス上に形成した高品質 CIS 薄膜 を可塑基板上へと引き剥がし転写する技術 の確立も目的とした。

3.研究の方法

(1) 成膜法改善による高品質結晶の作製法 図1に本実験で用いた三段階法の成膜プロセ スを示す。1段階目の基板温度を350、2段 階目と3段階目の基板温度を450 とした。 これは通常の三段階法において PI の耐熱性 を考慮した温度プロファイルである。2段階 目終了時のCu/In 比は1.1を狙い、最終的な Cu/In 比は0.9を狙いとした。 次にこの三 段階法と短時間熱処理を組み合わせ新たな 成膜プロセスを提案した。図2にこの新三段 階法の成膜プロセスを示す。このプロセスは 三段階法の2段階目終了時までは三段階法と 同じだが、3段階目の開始時(Cu-richのと き)に基板温度を500 まで急速(50 /分) に上昇させ、その温度で1分間保持すること により短時間熱処理を行い、その後再度 450 まで昇温時と同様に急速に温度を低下 させた。このときも三段階法と同様に2段階 | 目終了時の Cu/In 比を 1.1 とし、最終的な Cu/In 比は 0.9 を狙いとした。この三段階法 と新三段階法で作製したサンプルをそれぞ れエネルギー分散型 X 線分光法 (EDS), X 線 回折(XRD),走査型電子顕微鏡(SEM)を用 いて評価した。

(2)引き剥がしによる CIS 系薄膜の転写法 図 3 に引き剥がしによる CIS 系太陽電池の作 製プロセスを示す。まず、Mo でコートされた 青板ガラス (SLG)上に CIS 系薄膜[ここでは Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub>(CIGS)]を形成する。この CIGS 膜に引き剥がし後の裏面電極となる Mo を堆 積させた後に導電性エポキシで PI を貼り付 ける。乾燥後、鉛直上方に引っ張ることによ って CIGS 膜を PI 上に引き剥がす。この CIGS 膜に CdS、ZnO、ITO、取り出し電極を順次積 層することによって太陽電池を作製した。



4.太陽電池セル作製 3. PIへ引き剥がし (~100N/cm<sup>2</sup>) 図 3 引き剥がし法による CIS 系太陽電池の 作製プロセス

A1

SLG

4.研究成果

(1) 成膜法改善による高品質結晶

EDS 測定結果から、Cu/In 比に関してどちら のサンプルでも1.0>(Cu/In)>0.85とIn-rich になっており、太陽電池化に適した値に制御 することができた。Se/(Cu+In)比については どちらのサンプルでも 1.0(ストイキオメト リ)に近い値となり、安定していることがわ かった。

XRD により測定されたそれぞれの CIS のスペ クトルを図4に示す。CIS と Mo のスペクトル のみが観測され、異相がないことが確認され た。また(112)配向の半値幅に注目すると 三段階法では0.180°であったのに対し、新三 段階法では0.163°と値が小さくなり、結晶性 の改善が示唆された。

三段階法と新三段階法を用いて作製した CIS 薄膜の表面・断面 SEM 画像を図 5 に示す。表 面 SEM 画像より、三段階法で作製した CIS 結 晶に比べて新三段階法の CIS 結晶の方が僅か に大きくなっていることがわかる。断面 SEM 画像からは、三段階法で作製した CIS の結晶 粒径は約 1.0µm 以下なのに対し、新三段階法 で作製した CIS の結晶粒径は約 1.5µm と増大 が観られた。しかし、一方で膜中にボイドが 多数みられた。



図 4 CIS 薄膜の XRD 測定結果



図5 CIS 薄膜の表面・断面 SEM 画像

今回、このCIS 薄膜を用いて太陽電池を試作 したが、漏れ電流が大きく、太陽電池として 動作しなかった。これは膜中のボイドや通常 はSLG から供給されるナトリウムがなかった ことが原因であると考えられる。こういった 課題が解決されれば、太陽電池としての動作 を実現できると考えられる。

(2)引き剥がし CIS 系薄膜を用いた太陽電池 図 6 に引き剥がし CIGS 薄膜を用いて試作し た太陽電池の写真を示す。このように、フレ キシブルな太陽電池を作製できた。 PI 上に引き剥がした CIGS 薄膜を用いて作製 した CIGS 太陽電池の電流-電圧特性を図7に 示す。比較のために、SLG 上に引き剥がした ものと、引き剥がしを行っていない通常の太 陽電池の特性も図中に示した。また、図7か ら求めた太陽電池パラメータを表1にまとめ た。引き剥がしセルでは短絡電流密度( $J_{sc}$ ) は通常セルの 2/3 程度に低下した。これは図 8の分光感度(EQE)特性に示すように、長波 長感度が著しく低下したためである。これは 使用した CIGS 膜は表面から裏面に向かって 禁制帯幅が大きくなっていたために、それを 引き剥がしで裏返した場合に、逆グレーデッ ド構造となり、電流が取り出しにくくなった ためである。一方、開放端電圧 (V<sub>cc</sub>) は同程 度かあるいは向上した。これは引き剥がしセ ルの方が、np 接合における禁制帯幅が大きい ためである。曲線因子(FF)は逆グレーデッ ドの影響で、順方向電圧を印加時に光電流が 取り出しにくくなるために減少した。また直 列抵抗(Rs)は引き剥がしセルでは非常に大 きくなった。変換効率(Eff.)は、結果的に、 1/2 程度に減少してしまったが、CIGSの膜厚 方向への禁制帯幅分布を制御することによ り改善できると考えられる。

改善の余地はあるものの、引き剥がし法によるフレキシブル CIS 太陽電池の作製法を確立できた。



図 6 引き剥がし法 CIS 系太陽電池の外観



図 7 引き剥がし CIGS 太陽電池の電流-電圧 特性

表1 太陽電池パラメータ

	J <sub>sc</sub> (mA/cm²)	V <sub>oc</sub> (V)	FF (%)	Eff. (%)	Rs (Ωcm²)
Ref	36.6	0.382	58.0	8.1	0.8
SLG	23.4	0.367	40.4	3.5	Hich
PI	20.8	0.498	38.3	4.0	rign



図 8 引き剥がし CIGS 太陽電池の分光感度 (EQE) 特性

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

<u>T. Minemoto</u>, Y. Abe, T. Anegawa, S. Osada, H. Takakura, Lift-off process for flexible Cu(InGa)Se<sub>2</sub> solar cells, Japanese Journal of Applied Physics (査読有), (2010) 印刷中. <u>T. Minemoto</u>, T. Anegawa, S. Osada, H. Takakura, Layer transfer of Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> thin film and solar cell fabrication, Japanese Journal of Applied Physics (査読有), 49 (2010) 012301-1-4.

〔学会発表〕(計5件)

阿部泰宏,<u>峯元高志</u>,長田晋太郎,高倉秀行, リフトオフ法を用いたフレキシブル (Zn,Mg)0/Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub>太陽電池,第56回応 用物理学関係連合講演会,2010年3月18日, 東海大学(神奈川県).

<u>T. Minemoto</u>, Lift-off process for  $Cu(InGa)Se_2$  thin-film and solar cells, 1st Taiwan-Japan Joint Workshop on PV, 2009 年 11 月 26 日, ITRI(台湾).

<u>T. Minemoto</u>, T. Anegawa, S. Osada, H. Takakura, Lift-off process for flexible Cu(InGa)Se<sub>2</sub> solar cells, 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials, 2009年10月9日, 仙 台国際会議場(宮城県).

<u>峯元高志</u>,長田晋太郎,高倉秀行,犠牲層を 用いない引き剥がし法によるフレキシブル Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub>太陽電池,第6回「次世代の 太陽光発電システム」シンポジウム,2009年 7月2日,朱鷺メッセ(新潟県).

<u>T. Minemoto</u>, T. Anegawa, S. Osada, H. Takakura, Layer transfer of  $Cu(In,Ga)Se_2$  thin-film to alternative substrate and application to solar cells, 34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2009 年 6 月 11 日, Philadelphia (アメリカ).

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕

http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/takakur alab/

6.研究組織

(1)研究代表者
峯元 高志(MINEMOTO TAKASHI)
立命館大学・立命館グローバル・イノベー
ション研究機構・准教授
研究者番号:80373091